

1. Record Nr.	UNINA9910136274203321
Titolo	ANSI/IEEE Std 300-1982 (Revision of IEEE No 300-1969) : IEEE Standard Test Procedures for Semiconductor Charged-Particle Detectors // Institute of Electrical and Electronics Engineers
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 1992
ISBN	1-5044-0276-6
Descrizione fisica	1 online resource (154 pages)
Disciplina	338.4
Soggetti	Semiconductor industry
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia